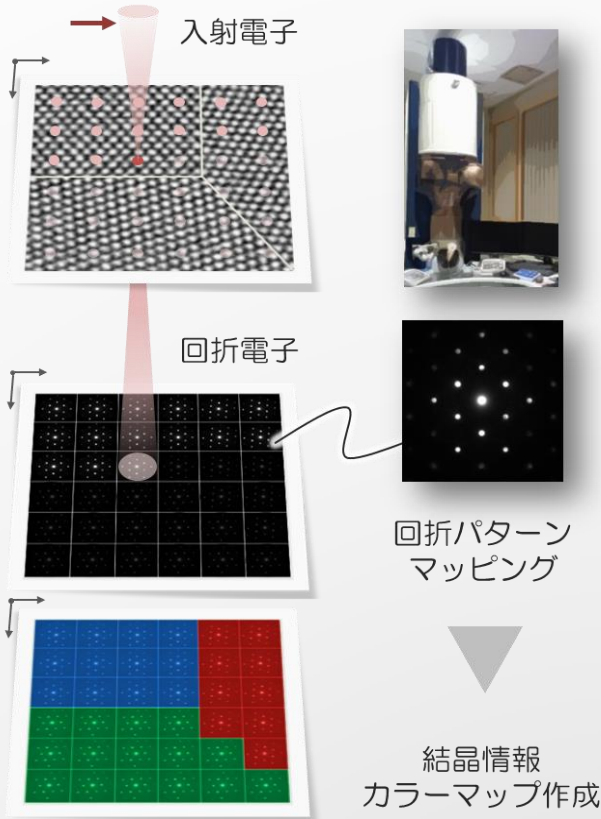


TEM ED-Map

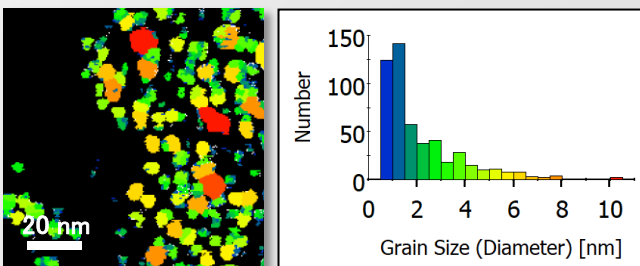
—TEM Electron Diffraction-Mapping—

測定原理

電子ビームで試料をスキャンし電子回折パターンのマッピング取得を行います。得られたパターンから結晶方位情報を解析し各種カラーマップを作成します。



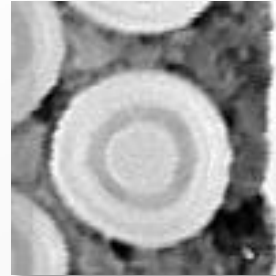
最小検出可能粒径 : 約2 nm~ (材質による)
最大取得範囲 : 4 μm×4 μm



Auナノ結晶の結晶粒マップ(左)
およびヒストグラム(右)

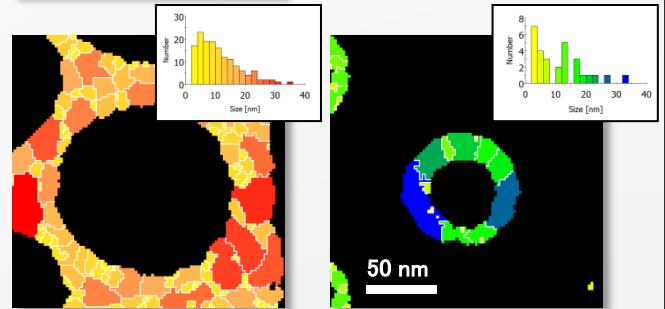
解析事例

◆ 粒径解析 - 3D NANDメモリ



複数の材質で構成されるデバイスなどについては、各材質ごとに結果を出力することができます。

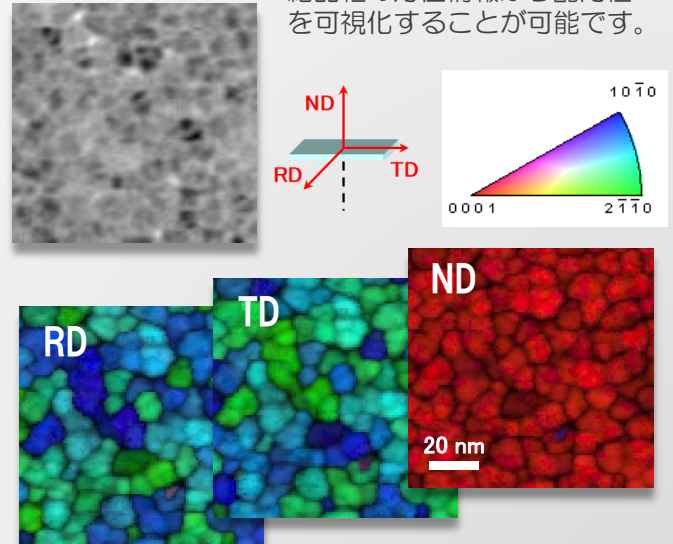
市販品のNANDメモリについて解析を行いました。



W(左) および Poly-Si(右)の
結晶粒マップとヒストグラム

◆ 配向性解析 - HDD 磁性ディスク

結晶粒の方位情報から配向性を可視化することが可能です。



CrCoPt 結晶粒の逆極点図方位マップ

MST

一般財団法人
材料科学技術振興財団

東京 大阪 名古屋 仙台
全国対応いたします

分析のご相談・お申し込みは、受付部門 (SPG) へ

TEL : 03-3749-2525 (東京) E-mail : info@mst.or.jp URL : <https://www.mst.or.jp/>

【設立背景】1984年「新材料の創製に関する総合的な研究開発の推進」という政府諮問を受けた航空・電子等技術審議会における答申に基づき、当財団は設立されました。

